

CMCIC2017中国测控技术与仪器大会 征文通知

测控技术与仪器是涉及电子学、光学、仪器学、精密机械、计算机、信息与控制技术等多项前沿科技的一门综合性的高新技术。伴随全球新一轮科技革命和产业变革的兴起,先进测控技术及其高端仪器设备将是我国实现“制造强国”战略的关键基础,将成为支撑各领域创新发展的前沿和热点方向。为进一步落实《中国制造2025》国家战略,加快推动测控技术与仪器的创新及应用发展,满足各行业创新应用需求,由中国光学工程学会联合多家权威机构于2017年6月在北京举办“2017中国测控技术与仪器大会”。

此次大会旨在进一步推动该领域的前沿技术创新与发展,探讨国内外先进测控、计量及检测技术与仪器设备的前沿创新技术成果、优秀的应用解决方案;希望将国际先进的测控、仪器技术和理念与国内实际需求交汇融合,真正搭建起该领域“产、学、研、用”的高质量互动交流平台。届时,欢迎业内广大高校、科研院所、重点实验室教师、研究生以及国内外高科技企业踊跃投稿,参会。

主办单位: 中国光学工程学会

承办单位: 中国高科技产业化研究会产学研合作协调部 中国测控网

联办单位: 中国高科技产业化研究会 中国无人机任务系统及技术产业联盟
中国光纤传感技术及产业创新联盟

名誉主席: 金国藩 院士 清华大学

叶声华 院士 天津大学

大会主席: 李天初 院士 中国计量科学研究院

丁 汉 院士 华中科技大学

张广军 院士 东南大学

时 间: 2017年6月5-7日

地 点: 北京中国国际展览中心(顺义新馆)

征文方向: (建议但不局限于如下方向)

测控信息采集和通信传输

测控信息与数据处理

测试、测量与仪器技术

智能检测控制技术及仪器仪表装置

软件技术/嵌入式系统

状态监测、健康管理及故障诊断

校准和可追溯性

仿真建模与试验测试

无人装备与测控系统技术

先进测控与智能制造

仪器与测量研究与工程

制导、导航与控制技术

测控技术与仪器前沿科学技术、发展趋势

投稿须知:

第一轮摘要截稿: 2017年4月28日

投稿要求: 请作者登陆会议网站<http://www.manuscript-cnoenet.com>(选择测控会议专题)先提交英文摘要,摘要长度为300-400个单词,详细要求参见会议网站。收到组委会发的录用通知后,请按通知要求将论文全文提交至SPIE网站。(稿件提交越早,审稿周期越短,希望感兴趣人员尽早提交论文!)

论文发表: 所有通过大会学术委员会专家审查被录用的英文论文,将由SPIE正式会议文集出版(Ei核心收录),会后约半年能够在Ei数据库检索到。部分优秀论文(含中文)将被推荐到合作期刊正式发表(SCI或Ei收录)。合作期刊:《红外与激光工程》(Ei)、《物理学报》(SCI)、《机械工程与自动化》(Ei)、《电力系统自动化》(Ei)、《中国测试》、《测试技术学报》、《计算机测量与控制》、《测控技术》、《航天控制》、《空间控制技术与应用》、《计算机工程》、《兵工自动化》、《太赫兹科学与电子信息学报》、《仪器仪表学报》、《工业控制计算机》、《控制理论与应用》(Ei)、《现代雷达》、《安全与电磁兼容》等。

论文发表与参会费: 会议注册费1600元/人,含资料,餐,杂支等。4月10日前报名汇款优惠为1200元/人。注册费不含版面费,版面费2600元,其他期刊投稿组委会不代收版面费(按照期刊要求自行缴纳);无论是否投稿均欢迎参会。推荐提前电汇,请务必注明参会人“姓名+测控”。

具体要求详见官方网站: <http://www.ck365.cn>

组委会联系方式

联系人: 张老师 高老师 顾老师

电话: 010-68832370 邮箱: ckdh365@163.com 手机: 15300121106